行政院國科會98年度研究計畫期中報告 計畫名稱:低能隙光電用聚方酸類高分子的合成與特性研究(2/3) 計畫編號:NSC97-2221-E009-012-MY3 計畫主持人:黃華宗 執行機構:國立交通大學材料科學與工程學系

## Abstract

In this article, two kinds of polysquaraines, which the octyl functional group were located at different place, were synthesized through polycondensation 1-octylpyrrole of and 3-octylpyrrole with squaric acid. The structures and properties of different polysquaraines have been characterized by measuring UV-Vis spectra and FT-IR spectra. We further prepared the codoped phenanthrenequinone polysquaraine into doped poly(methyl methacrylate) (PMMA/PQ) photopolymer. Try to utilize polysquaraines to improve the holography data storage characteristics.

The results were shown that the diffraction efficiency of PMMA/PQ has been improved to be 6 times larger through codoping polysquaraine. The dynamic range and sensitivity also have been increased at the same time.

# 摘要

以 1-octylpyrrole 以及 3-octylpyrrole 與 squaric acid 來共聚合,形成取代基位置不同 的兩種 polysquaraine,並以紅外線吸收光譜 以及紫外光可見光光譜圖鑑定其結構與特 性探討。我們將 polysquaraine 加入於 PQ 混 摻 PMMA 的全像材料中,發現整個系統的 繞射效率及動態範圍還有全像片的敏感度 皆有所提升;繞射效率原本的 9%上升到 55%,提升 6.11 倍左右;材料的動態範圍(M#) 則從 0.47 增加 1.05,提升了 2.23 倍;而材 料敏感性方面則從 0.056 cm<sup>2</sup>/J 增加到 1.47 cm<sup>2</sup>/J,是原本的 2.61 倍之多。

## 一、緒論

Squaraine,又可稱為 squarylium dye 或是方酸菁,是一種有機染料。其基本結構 相當的簡單—分子結構中心是由方酸 (squaric acid)反應後所留下的四圓環,加 上兩個末端是芳香環或是具芳香性的共軛 雜環所組成。

Squaraine 最吸引人的特點在於這類染 料於可見光至紅外光這段區域中有非常強 烈且集中的吸收。很多的小分子甚至高分子 都不一定具有這樣的特性,而 squaraine 卻 可以以相當簡單的結構就達到。這是因為 Squaraine 本身的結構是由多電子的電子給 體與缺電子的電子受體組合而成,因而產生 強烈的推拉電子效應,導致結構間的鍵結更 具有雙鍵的特性。此外,由於芳香環或具芳 香性的雜環分子與殘留的四圓環會形成 1,3-雙取代的結構,這樣的結構可形成一個 共軛的平面,不利扭轉而有助於維持芳香性, 而在主架構中所有的鍵結有良好的共軛性, 因此也有利於載子傳遞。

若將 squaraine 的主鏈延伸,也就是不 斷重複電子給體電子受體交錯來形成主鏈, 就可得到高分子型態的 Squaraine,我們稱 之為 polysquaraine。多電子的芳香族化合 物若有著兩個具反應性的位置可與缺電子 的 squaric acid 反應,則就可沿用對稱型 的合成方法來得到 polysquaraine。透過由 四環與芳香環或雜環重複交替組成的高分 子骨架可將能隙降到更低。延伸的共軛結構 也使得他的能隙更小,對於提升本質導電度 也有所幫助。 由於藉由調整所使用的多電子芳香環或 雜環即可控制結構的多變性,因此合成出可 調控光學性值的 squaraine/polysquaraine 就變得很容易了。設計不同結構的 squaraine/polysquaraine,賦予其不同的 光化學與光物理性質,使得 squaraine/polysquaraine 近幾年來在多個 領域 squaraine/polysquaraine 都有令人注 目的貢獻。

Squaraine 的於 1965 年由 Triebs 與 Jacob 將 3, 4-dihydroxycyclobut-3-ene-1, 2-dione (squaric acid)與兩當量的 pyrrole 在酸性環境下反應,得到了最初始 的 squaraine。但該物的溶解度極差,可說 是完全不溶於任何溶劑<sup>1,2</sup>。

而後來 Sprenger 與 Ziegenbein 使用相 似的反應合成出數種 squaraine azuleno-squarylium 及 anilinosquarylium <sup>3,4</sup>。他們使用親核性的 aniline 或 azulene 衍生物與 squaric acid 反應,在含有正丁 醇與苯的混和溶劑中共沸而得到產物,成為 後來大多數人普遍使用的合成方式。 Havinga 等人的研究對於 squaraine 結構方 面提供了相當大的貢獻。使用了 benzobisthiazoles 與 squaric acid 以及 croconic acid (squaric acid 的同系物) 合 成 出 polysquaraines 與 5,6 o polycroconaines 由於更好的 donor-acceptor 所 特 性 以

polycroconaines 顯示了比 polysquaraine 更低的能隙。

Eléna Ishow 於 2007 年提出,使用具有 azobenzene group 做為部分結構的 squaraine 可利用其非線性光學性質來製備 全像光栅<sup>7</sup>,結合本實驗室在 PMMA/PQ 全像 材料上的開發,我們認為 polysquaraine 與 MMA 既然能夠產生光化學反應,那麼是有可 能將這兩種材料應用於全像方面。因此我們 使用 polysquaraine 摻雜於 PMMA 做為全像 材料,也因此我們在此對全像術與全像材料 加以說明。

全像術(Holography),是一門立體光學 儲存的技術,只要利用同調的物體光與參考 光所構成的干涉光源加上適當的感光介質, 就可記錄物體在三度空間中的資訊,故可以 快速的存取資訊且儲存大量資料。全像術使 用兩道同調性很高的雷射光束,而這兩道雷 射光束可藉由將一束雷射光束利用分光鏡 分成兩束得到。將其中一束雷射光照射在物 體上,我們稱這道光束為物體光,物體光被 物體反射後挾帶著物體資訊來到全像片上。 而另一束雷射光,我們稱為參考光,則直接 引到全像片上。兩道光於感光材料(全像片) 上互相干涉,形成亮暗不一的干涉條紋,再 藉由這些干涉條紋將物體光的振幅與相位 的資訊儲存於全像片中。這些干涉條紋使得 全像片本身成為一個複雜的光柵。當我們要 讀取資訊時,便以原參考光照射拍好的全像 光柵,利用每個區域繞射光的繞射角度不同, 在繞射光的方向還原出物體的訊號光。這就 是全像術的記錄與重建。

全像術不同於以往的技術是因為一般的 CD 或 DVD 是以 2D 系統來儲存資料,而體積 全像技術(Volume Holography)則可將儲存 空間延伸至 3D,因為整個空間都可建立干涉 條紋。藉由旋轉儲存媒體,多重干涉條紋可 以儲存在同一個體積中,因此允許了小體積 但擁有高密度的資料儲存<sup>8,9</sup>。

找出適合的材料來運用在全像片的製作 上是相當重要的需求。一般而言,製作全像 媒體可分成三大種材料:光折變材料 (Photorefractive materials)、光寫入材 料(Photoaddressable materials)以及感光 高分子材料(Photopolymer),而在這當中感 光高分子材料受到了大家的矚目,它具備了 以下優點:對光的敏感度比光折變晶體與光 寫入材料高;雖然光折變材料具備有非破壞 性讀取的優點,但是該種材料可能在數小時 後自動將記錄的資訊抹除;此外光折變材料 需要培養單晶,製作成本高。而在光寫入材 料方面,通常引入具有 azobenzene 的基團。 這類材料具備可重複讀寫的特性,且加入這 樣的官能基可以讓被記錄的資料維持長時 間的穩定性,但是所製成的全像片繞射效率 低。感光高分子不僅光敏感性高、材料動態

範圍大,且這類材料可以維持長時間的穩定性,讓儲存的資訊可被長時間的保存。另外, 感光高分子的樣品製備簡單,成本低廉,因 此近年來成為熱門的研究目標<sup>10</sup>。

由於 polysquaraine 其結構中心的四圓 環容易受到親核性攻擊,而染料 PQ 則在照 光後可以形成帶負電的自由基<sup>11</sup>,我們認為 這兩者很可能在一光照環境下產生光化學 反應,因此我們也使用了 polysquaraine 與 PQ 混摻、將 PMMA 當作基材來製作全像片。 我們將量測這兩個全像系統的繞射效率、動 態範圍以及材料敏感性。藉此希望能製作出 新的高品質感光高分子材料。

# 二、實驗

2.1 poly(1-octylpyrrole-co-squaric acid)合成

將三頸反應瓶與回流裝置組裝好,三頸 反應瓶需要加裝分水器以達到共沸蒸餾之 目的,之後抽真空再填充氮氣,抽充三次, 確保反應環境無其他雜質干擾。將squaric acid(0.57g,5mmol)與pyrrole的衍生物 — 1-octylpyrrole(0.895g,5mmol)以 1:1的比例加到三頸反應瓶中,反應瓶中加 入1-丁醇(20mL)與苯(10mL)的共溶劑。加 熱反應的混合液體,期間需要不斷地攪拌。 回流24個小時後即可得到較為稠狀的暗 藍色溶液。將此暗藍色溶液抽氣過濾後再迴 旋濃縮,收集固體。接著再使用乙醚來浸洗 這些固體。抽氣過濾收集沒有溶於乙醚的部 分,再溶於氣仿中,重複純化步驟,即可得 到產物。



# 2.2 poly(3-octylpyrrole-co-squaric acid)合成

與2.1上述步驟相同,使用同樣的裝置。 squaric acid(0.057 g, 0.5 mmol)與 pyrrole 的 衍 生 物 — — 3-octylpyrrole(0.0895 g, 0.5 mmol)加到 有著1-丁醇(20 mL)與苯(10 mL)之共溶劑的 三頸反應瓶中。

$$\mathbf{R}$$
:  $\mathbf{C}_{8}\mathbf{H}_{17}$ 

#### 2.3 全像材料製備

將計量的 Polysquaraine 溶於
dichloromethane中,在室溫下攪拌30分鐘。
取1g的 PMMA 及計量的 Polysquaraine 溶
液,加入dichloromethane中(PMMA 溶液固
含量為20%(W/W))於室溫下攪拌待PMMA完全

溶解後,再添加0.05 g的PQ於溶液中,持續 攪拌約2hr,則可得到高黏度的PMMA/PQ/PSQ 的溶液。使用乾淨的玻璃板,650 μm間隙 的刮刀置於此玻璃板上,將上述反應所得到 的溶液倒於玻璃板上,以適當的推力刮成平 坦均匀的薄膜,再放到溫控加熱板上以35℃ 烘烤30分鐘去除dichloromethane,所得薄 膜以供紫外光譜分析、折射率分析與全像記 錄分析測量用。在此研究中PSQ1加入的重量 百分比比例為:0.03、0.04 W/W%,而PSQ3 加入比例分別為:0.05、0.07和0.1 W/W%。 本文為方便起見使用代號來表示各系列樣 品,代號為PMMA/PQ/xPSQy,此處x代表PSQ 的重量百分比,y表示烷鏈取代基於pyrrole 上的位置。

#### 三、結果與討論

#### 傅氏紅外線光譜分析(FTIR)

本研究僅就 PSQ1 與 PSQ3 的紅外線光譜 與文獻來相對照<sup>12</sup>,證明是否合成出我們所 需的高分子結構。圖 1 和圖 2 分別為 PSQ1 與 PSQ3 的 FT-IR 光譜圖,從圖中,我們發 現 PSQ1與 PSQ3 於 1620 cm<sup>-1</sup> 附近都有強烈 的吸收,這是 Polysquaraine 結構中由 squaric acid 提供的四環部分上的 CC + CO 鍵結的 stretching 所引起的<sup>13</sup>。這個部分的結構應為 沿著整個高分子骨架電子未定域化的共振 結構,故四環上面的碳氧鍵結性質應介於雙 鍵與單鍵之間,也因為這樣的共軛效應,使 得雙鍵的π電子分散在整個共軛系統上,顯 示出這樣的高分子有一個共振穩定的 zwitterion 結構<sup>14</sup>。此外,在1730 cm<sup>-1</sup>與 1790 cm<sup>-1</sup> 附近, PSQ1 與 PSQ3 兩者皆有強 度較弱的吸收峰出現,這可能是因為四環上 所擁有的 C=O 鍵結所致,與 squaric acid 於 該處的吸收峰相比, PSQ1 與 PSQ3 的吸收 波數較小;而與 squarate 相比,共軛程度顯 示相近,因此該處的吸收峰可引申為有確實 的共振結構<sup>15</sup>。而也有其他篇文獻指出<sup>14</sup>, 1700 cm<sup>-1</sup> 附近的吸收峰也有可能是因為高 分子鏈尾端結束部分的官能基或者是形成 微量比例的 1,2-oriented diketonic isomer unit 接在高分子骨架上做為一個副產物所導致 的現象。

#### 紫外光可見光光譜儀(UV-Vis)

將 PSQ1 以及 PSQ3 溶入 chloroform 中, 量測得其紫外光可見光光譜圖,結果如圖 3。



圖 1 PSQ1 之傅式紅外線光譜分析圖



圖 2 PSQ3 之傅式紅外線光譜分析圖



圖 3 PSQ1 與 PSQ3 溶於 chloroform 之溶 液紫外光可見光光譜圖

圖3為PSQ1與PSQ3的chloroform溶液所 測得之紫外光可見光光譜疊圖,兩者的最大 吸收波長約在550nm附近;由於在調配溶液 的過程中,沒有將掺入的polysquaraine定量, 因此我們將圖譜normalized,單純表示PSQ1 以及PSQ3的最大吸收波長位置。

## 光化學分析

圖4為掺入不同PSQ3含量於PMMA/PQ 全像材料在曝光前後的紫外光-可見光光 譜圖。曲線的命名表達了PMMA 混掺PQ 全 像材料中所掺入不同重量百分比的 PSQ3, 而這樣的系統又再細分為曝光前與曝光後 的情況。

在此圖中我們可以發現, 位於 514 nm 的 位置吸收峰強度小, 伴隨著 PSQ3 的增加而 有提升的現象, 而在 532 nm 的位置的吸收 峰,由於加入了 PSQ3,導致此波長下的吸 收強度太大,因而不利於全像的記錄,故我 們選擇了514 nm 為我們所使用的雷射波長。 圖中 PSQ3 在550nm 處的吸收強度隨著加入 的比例不同而有所變化,而未掺入 PSQ3 的 單純 PQ 混掺 PMMA 吸收曲線則是在550 nm 處沒有吸收峰。所有樣品在完全曝光後, 可以很清楚的發現不同含量下的 PSQ3 其吸 收峰都消失不見了,此外,在420 nm 處代 表 PQ 的吸收峰,不論有無加入 PSQ3,也在 曝光後消失了。



圖 4 不同 PSQ3 含量於 PMMA/PQ 全像片的紫外光可見光光譜圖

圖 5 則為掺入不同 PSQ1 含量於 PMMA/PQ 全像材料的紫外光可見光光譜圖。 在圖中我們所觀察到的現象與 PSQ3 系列相 比差異不大,但由於 PSQ1 的溶解度太差, 因此在紫外光可見光光譜圖中,PSQ1 的吸 收強度就相對的低了許多。不過因為在 532nm 附近的吸收還是會因為加入 PSQ1 而 有較大的吸收值,因此適合使用 514nm 的雷 射光來做為記錄與讀取。



圖 5 不同 PSQ3 含量於 PMMA/PQ 全像片的紫外光可見光光譜圖

## 繞射效率量测

使用經過同調化、波長為514 nm的氫離 子雷射,並以兩道雷射夾角30°的角度入射至 樣品表面,來做光柵寫入的動作。再使用514 nm的光源做為讀取光源來量測繞射效率的 強度。我們定義繞射效率(η)為繞射光強度(I<sub>D</sub>) 除以繞射光強度加上穿透光強度(I<sub>T</sub>)的總 和:

$$\eta = \frac{I_D}{I_D + I_T}$$

而繞射效率又可定義為:

$$\eta = \sin^2 \frac{\pi \Delta n d}{\lambda \cos \theta}$$

其中 θ 即為布拉格角,而 λ 為使用雷射 之波長,d 則為全像片的厚度,Δn 是調製 折射率。

圖 6 是將不同含量的 PSQ1 掺入 PQ 混掺 PMMA 系統的繞射效率圖,曲線的命名方式 同圖 6,也就是 PMMA 混掺 PQ 全像材料中 所掺入不同重量百分比的 PSQ1。

以圖 6 中黑色曲線為例,我們可以看到 單純摻雜 PQ 的高分子系統中,當曝光能量 到達 3.0 J/cm<sup>2</sup>時,繞射效率達到最大值,但 曝光能量超過 3.0 J/cm<sup>2</sup>後,繞射效率開始下 降,這是雜訊光柵產生所致。雜訊光柵是材 料的散射中心或是組成的均勻性不足所造 成,導致大部分入射光的能量被散射掉,這 也是體積全像或是光折變材料的特性<sup>16</sup>。因 此當給予的曝光能量產生繞射效率最大值 時,表示記錄單一全像的曝光能量已達上限, 也就是說在全像多工記錄時每一張全像的 曝光能量不能超過此一上限值,否則記錄的 全像品質會降低。

此外我們發現,隨著添加的 PSQ1 的含量 越多,繞射效率就越低 (0.1%)。由於純 PQ-PMMA 系統的繞射效率是由 PQ 與 MMA 單體反應產生的折射率差異貢獻而來, 可能是因為 PSQ1 會與 MMA 單體以及 PQ 產生化學反應,使系統中的 PQ 和殘存的 MMA 單體數目減少,以及 PSQ1 與 PQ 以及 MMA 所形成光化學產物對折射率差異並無 明顯貢獻,造成反應之後對折射率差異有貢獻的產物的總量下降,因此折射率的落差就 縮小了,而繞射效率也跟著下降。



圖 6 不同 PSQ1 含量於 PMMA 混掺 PQ 系 統之繞射效率與(a)曝光能量關係圖(b)曝光 時間關係圖

而在 PSQ3 掺入 PQ 混掺 PMMA 的系統 中,整體趨勢卻完全相反,如圖 7 所示。隨 著加入的 PSQ3 的含量越來越多,整個系統 的繞射效率也越來越大。一開始純 PQ 混掺 PMMA 系統的繞射效率約為 9%,加入重量 百分比為 0.05%(W/W)、0.07%(W/W) 到 0.1%(W/W)的 PSQ3 後,繞射效率由 20%、 45%提升到 55%,比原本純 PQ 系統的繞射 效率成長了接近六倍左右。整個系統反應時 間雖然大於單純 PQ 混掺 PMMA 系統,但是 隨著 PSQ3 添加量的增加,反應速率也有加 快的趨勢,這可能是因為在 514 nm 的波長 處,其吸收度隨 PSQ3 增加量變多因而強度 提升,使得吸收能量的效率也提高故反應速 率加快。



圖 7 不同 PSQ3 含量於 PMMA 混掺 PQ 系 統之繞射效率與(a) 曝光能量關係圖(b)曝光 時間關係圖

雖然在 PSQ3 掺入 PQ 混掺 PMMA 的系統中,我們大幅提升了繞射效率,但是在

PSQ3 掺入 PMMA 做為試片的樣品卻量測不 到繞射效率。這有可能是因為PSQ3與MMA 單體反應後的產物對於折射率的落差是沒 有貢獻的。基於上述可能的原因,我們推測 在PSQ3 掺入PQ 混掺PMMA 系統其繞射效 率可以提升的是來自於 PSQ3 與 PQ 產生了 光化學反應或者是 PSQ3 與 PQ 以及 PMMA 反應之後的產物發生反應,這些產物與曝光 前的樣品有明顯的折射率差異,使得整體的 繞射效率有顯著的提升。由圖 6 與圖 7 的比 較,我們發現當 PSQ1 的含量增加時,會使 整體的繞射效率有下降的趨勢,反而加入 PSQ3 時,整體的繞射效率的趨勢有明顯的 提升,因此我們在後續的研究中,就針對有 添加 PSQ3 系統的材料,進一步的探討在動 態儲存上的特性。

# 動態儲存範圍量測

全像資料儲存材料中有兩個重要的參數, 分別為折射率或吸收系數產生變化所導致 的動態範圍以及全像記錄片的敏感度。全像 記錄的動態範圍是用來衡量全像片所能記 錄的容量大小,若動態範圍越大,所能記錄 的張數則越多,故可以提供更多的資料儲存。 而敏感度則是用來衡量資料記錄速率的參 數,若使用的全像記錄雷射功率固定,則材 料有著越大的敏感度,代表固定時間內該全 像片以較少的曝光能量完成資料儲存;或者 是在相同的曝光能量下較快完成資料儲存 (有較快的資料儲存速度)。

我們在材料的單一位置利用旋轉多工技 術記錄了 200 張全像,每張曝光能量約為 0.104 J/cm<sup>2</sup>。每一張全像的繞射效率在量測 完之後加以記錄,由於動態範圍即是單一點 所記錄的所有全像其光柵強度的累加飽和 值<sup>[69]</sup>,其定義為繞射效率的平方根總合就代 表了形成累加的光柵強度,其表示方式為:

$$C_{sat} = \sum_{ii=1}^{n} \sqrt{\eta_i} = M/\#$$

其中n是在整體曝光能量EJ/cm<sup>2</sup>下所記錄 的總共全像張數。圖8即為摻雜不同濃度的 PSQ3高分子於PQ混摻PMMA系統中的動 態曲線。



圖 8 掺雜不同濃度的 PSQ3 於 PQ 混掺 PMMA 系統中的動態曲線

圖 8 中每一條曲線在超過一特定的曝光 能量之後每一條曲線達到一特定的飽和值, 這是因為可形成光栅的材料已經被消耗光 了,因此即使提供再多的能量也無法記錄更 多全像。也就是說,當記錄張數→n時,Csat 值會趨近於飽和,該飽和值就是 M/#;從這 張圖我們也可以發現,當摻入越多的 PSQ3 高分子時,M/#值從原本單純PQ 混摻 PMMA 系統中的 0.45、0.5、0.6 上升到達 1.05,是 原本的 2.3 倍,這即代表了適當的摻入 PSQ3 於系統中,記錄的資料量或許可以加倍。

而這樣的動態範圍曲線,我們可以使用 指數函數方程式加以分析,方程式如下:  $C(E) = C_{sat} \left[ 1 - \exp \left( - \frac{E}{E_{\tau}} \right) \right]$  (1) 其中,Csat 等同於 M/#,E 是累積的曝光能 量,而 ET 則定義為特徵曝光能量。

對於摻雜不同濃度的 PSQ3 高分子的樣 品,我們以公式所計算得到的 M/#與 Eτ 的 值列於表 1, M/#、Eτ 以及 Sensitivity 則代 表的是該系統對應的動態範圍、特徵曝光能 量以及材料敏感度。

表 1 掺入不同含量 PSQ3 於 PQ/PMMA 系統的 M/#、特徵曝光能量與材料敏感度比較

Sample	M/#	Ετ	Sensitivity
		(J/cm <sup>2</sup> )	$(cm^2/J)$
PMMA/PQ	0.47	8.33	0.056
PMMA/PQ/0.05PSQ3	0.53	7.69	0.069
PMMA/PQ/0.07PSQ3	0.62	5.88	0.105
PMMA/PQ/0.1 PSQ3	1.05	7.14	0.147

Sensitivity(縮寫成 S)的定義為材料敏感 度,其表示式如下:

$$S = \frac{\sqrt{\eta}}{dtI}$$

其中 t 為記錄所花的時間, I 則為記錄光束能 量的累加強度。

由於在多次量測的全像記錄中,第一次 記錄的全像片其折射率差異是很小的,因此 對於第一次記錄的全像片,上述的指數方程 式(1)可以用線性方程式來近似:

$$C(E) \approx M/\# \times \frac{E}{E_{\tau}}$$

經過公式推演,我們可推得:

$$S_{\eta^{1/2}} \approx \frac{M/\#}{E_{\tau}}$$

故我們得到材料敏感性可用 M/#除以特 徵曝光能量來定義。材料的敏感性可用來描 述在相同曝光強度下的記錄速度快慢;或者 是相同的記錄時間內所需的曝光量多寡。當 一個材料擁有較佳的敏感度又有較好的 M/# 值時,表示這樣的材料只需要較少的曝光能 量或較短的曝光時間即可記錄較多的資料 量,也就是說可以快速的儲存大量資料,因 此在資料處理方面是相當有利的。從上表我 們可以看到,一開始的系統中材料敏感度為 0.056 cm<sup>2</sup>/J,但是隨著 PSQ3 高分子的添加 量的增加時,所需的特徵曝光能量從一開始 的 8.33 J/cm<sup>2</sup> 下降至 7.14 J/cm<sup>2</sup>,而材料的敏 感度上升到 0.147 cm<sup>2</sup>/J,增加幅度約為三倍, M/#也有明顯的提升。這說明了適當的添加 PSQ3 於 PQ 混摻 PMMA 的感光高分子系統 中確實改善了體積全像記錄上的 M/#與敏感 度等特性。

#### 四、結論

以紅外線吸收光譜以及紫外光可見光光 譜圖的圖譜分析,證明我們成功的合成出 poly(1-octylpyrrole-co-squaric acid)以及 poly(3-octylpyrrole-co-squaric acid)。而且將 不同的polysquaraine掺入PQ混掺PMMA系 統再將其製作成全像片,發現掺入PSQ3對於 全像片性質,諸如繞射效率、動態範圍以及 全像片敏感度都有所提升。以繞射效率來說, 從沒有掺入PSQ3的系統到掺入PSQ3 1.0mg 的樣品來看,繞射效率從原本的9%上升到 55%,繞射效率提升至6.11倍左右。以材料 的動態範圍來說,從原本沒掺入PSQ3的0.47 增加到掺入0.1wt% PSQ3的1.05,提升了2.23 倍。而在材料敏感性方面,一開始沒有掺雜 PSQ3的純PQ混掺PMMA系統,其材料敏感 性為0.056 cm<sup>2</sup>/J,加入0.1wt% PSQ3後,材料 敏感性增加到1.47 cm<sup>2</sup>/J,是原本的2.61倍之 多,顯示掺入PSQ3的全像片可使用較小的能 量或是可以用較快的速度完成資料寫入與 讀取。

# 參考文獻

- A. Treibs, K. Jacob : Angew. Chem., Int. Ed., 4, (1965) 694.
- 2. A. Treibs, K. Jacob : Liebigs. Ann. Chem.,699, (1966) 153.
- 3. W. Ziegenbein, H.E. Sprenger : Angew. Chem., Int. Ed., 5, (1966) 893.
- 4. H.E. Sprenger, W. Ziegenbein : Angew. Chem., Int. Ed., 5, (1966) 894.
- E. E. Havinga, W. ten Hoeve, H. Wynberg : Polym. Bull., 29, (1992) 119.
- E. E. Havinga, W. ten Hoeve, H. Wynberg : Synth. Met., 55, (1993) 299.
- 7. L. H. Liu, K. Nakatani, R. Pansu, J. J. Vachon, P. Tauc, E. Ishow : Adv. Mater., 19,

(2007) 433.

- 8. R. A. Lessard, G. Manivannan, : Proceedings of SPIE, 2405, (1995) 2.
- 9. P. Judeinstein, P. W. Oliveira, H. Krug, H. Schmidt : Adv. Mater., 7, (1997) 123.
- 10.S. Lee, Y. C. Jeong, Y. Heo, S. I. Kim, Y. S.Choi, J. K. Park : J. Mater. Chem., 19, (2009) 1105.
- 11.D. J. Gordon, R. F. Fenske : Inorg. Chem.,1, (1962) 904.
- 12.C. R. Chenthamarakshan, J. Eldo, A.Ajayaghosh : Macromolecules, 32, (1999)251.
- 13.C.E. Silva, R. Diniz, B. L. Rodrigues, L. F.C. de Oliveira : J. mol. struct., 831, (2007)187.
- 14.C. R. Chenthamarakshan, A. Ajayaghosh : Chem. Mater., 10, (1998) 1657.
- 15.A. C. Sant'Ana, L. J. A. de Siqueira, P. S. Santos, M. L. A. Temperini : J. Raman Spectrosc., 37, (2006) 1346.
- 16.M. Goulkov, T. Granzow, U. Dörfler, Th.Woike, M. Imlau, R. Pankrath, W.Kleemann : Opt. Commun., 218, (2003) 173.